

# 加藤 健太郎 (KATOH Kentaroh)

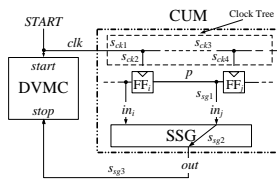
准教授 博士 (工学)

専門分野: LSIテスト法, ディペンダブルLSI設計法,  
研究キーワード: LSIテスト, テスト容易化設計, ディペンダブルLSI,  
Tel: 0235-25-5047 Fax: 0235-24-1840 (総務課)  
E-mail: k-katoh@\*\*\*\*\*

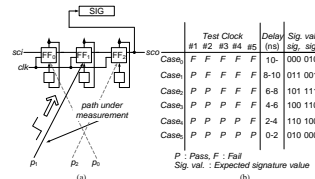


## 【研究シース】

1. 微小遅延故障検出法に関する研究  
LSI製造プロセスの微細化に伴い顕著となっている微小遅延故障の検出法, 検出容易化設計法の研究。
2. 超微細LSI製造プロセスの製造ばらつきを考慮したLSI設計法に関する研究  
LSI製造プロセスの微細化を考慮したLSI設計法に関する研究。
3. オンライン故障検出法に関する研究  
出荷後にフィールド(顧客先)で発生する故障のマスクや検出法に関する研究。特にFPGAを対象に研究を行っている。



考案した組み込み微小遅延検出方式 (1)



考案した組み込み微小遅延検出方式 (2)

(1 ~ 3 に関するシースをお待ちしております。)

## 【その他のシース】

4. 小規模の研究用のLSIの試作経験を有する。  
先行開発, 先行研究のための簡単な試作LSIチップであれば制作が可能です。
5. C++による3.5インチHDD用ドライブファームの開発に関する実務経験を有する。  
サーバ制御のドライブファームの業務コードの開発経験があります。

## 【過去の主な相談・共同研究・受託研究等】

## 【メッセージ】

LSIのテスト容易化設計に関する事なら, 少しはお役に立てるかもしれません。  
お気軽にご相談下さい。